

温度サイクル試験

温度サイクル試験(TCT)は、温度変化による熱ストレスを与えて耐性を確認する環境試験です。電子部品は、熱膨張係数が異なる様々な材料により構成されています。このため熱膨張係数の違いによる応力が発生し、不具合が生じる場合があります。そこで外部環境あるいは自己発熱により、温度が繰り返し変化する環境を想定し指定されたサイクル数のストレスを加える環境試験を行い、耐久を確認します。



1 仕様

型式	仕様
TSA-202ES-W	内寸:W640×H460×D670[mm] 温度: +60°C~+200°C
NT-1510	内寸:W320×H350×D450[mm] 温度: +60°C~+200°C
SP-61NX-A	内寸:W290×H70×D280[mm] 温度: -60.0°C~+150.0°C

2 料金

試験時間により変動します。別途ご相談ください。

3 適応例

半導体部品の環境試験

4 必要情報

- 1.目的/測定内容
- 2.試料情報
 - (1)数量・形状・通電有無・重量
 - (2)取り扱い注意事項
- 3.納期
 - (1)ご希望の速報納期
 - (2)注意事項
- 4.その他の留意点

ご相談およびご依頼の内容は、機密厳守を第一に細心の注意を払っています。特にご希望の場合は秘密保持契約をさせていただきます。